TAYLOR-CCI

粗糙度仪

产品类别：粗糙度仪

所属系列：TAYLOR

CCI HD适合用于制造和研究领域，可测量厚度至1.5微米的厚膜及厚度至50纳米的薄膜涂层。



图 1 产品外观

一、产品简介

CCI HD适合用于制造和研究领域，可测量厚度至1.5微米的厚膜及厚度至50纳米的薄膜涂层。

二、产品介绍

CCI HD适合用于制造和研究领域，可测量厚度至1.5微米的厚膜及厚度至50纳米的薄膜涂层。 CCI HD 是一种非接触式光学 3D 轮廓仪，具有测量薄膜和厚膜的功能。 它采用享有的新型关联算法，来查找由我们的精密光学扫描装置产生的干涉图的相干峰和相位。 这种新型的 CCI HD 整合了世界领先的非接触式尺寸测量功能和先进的厚薄膜测量技术。 CCI HD 除了提供尺寸和粗糙度测量功能，还可以提供两种类型的膜厚测量。 近年来厚膜分析被用于研究厚度至约 1.5 微米的半透明涂料；测量的厚度限制取决于材料的折射率和标的物的 NA。 测量较薄的涂层被证实为难度更高。 一、现在通过干涉测量法可以研究厚度至 50 纳米（同样取决于折射率）的薄膜涂层。 采用这种新型方法，可以在单次测量中研究膜厚、界面粗糙度、针孔缺陷以及薄涂层表面的剥离等特性。 1.2048 x 2048像素阵列，视场广，高分辨率 2.全量程0.1埃的分辨率 3.适用于0.3% - 100%的表面反射率 4.RMS 重复精度 < 0.2埃，阶跃高度重复精度 < 0.1% 5.多语言版本的64位控制和分析软件 1.CCI MP-HS非常适合用于研究领域，从非常粗糙的表面到极其光滑的表面，任何类型的表面它都能测量，因而具备测量各种元件的能力。 2.无论测量的是何种元件，无论对分析速度的要求有多高，我们创新的CCI MP-HS非接触式光学轮廓仪都能为您提供精密的3D表面测量结果。 一百万高速相机与1/10埃垂直分辨率相结合，无论是测量非常粗糙的表面，还是测量极其光滑的表面，都能获得令人不可思议的详细分析。 3.CCI MP-HS极大地扩展了分析能力，同时又不至于让分析程序变得更复杂。 您可以测量各种各样的元件和表面，不需要进行复杂的测量模式切换，也不会给中间透镜的校准增加额外的负担。 通过标准化的方法、程序和报告，CCI MP-HS可轻松地整合到您的质量管理系统中。 1.1048 x 1048像素阵列，视场广，高分辨率 2.高级X、Y、Z拼接，扩展量程 3.RMS重复精度 < 0.2 埃，阶跃高度重复精度 < 0.1% 4.整合抗振，优

四、技术参数

详细参数以出厂检测报告为准，可联系工程师索取完整参数表。

注：参数为标称配置，实际以合同与技术协议为准；非标行程、测头与软件功能可按需定制。

五、适用标准

- GB/T 1031 表面粗糙度参数及其数值
- GB/T 10610 表面结构 轮廓法评定规则
- GB/T 1958 产品几何技术规范(GPS) 几何公差检测规定
- GB/T 1800.1 极限与配合 基础
- GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值

六、关联内容与同系列产品

应用案例：来料验收·液压杆检测：电机与家电验收方案（248）；来料验收·液压杆检测：五金冲压验收方案（249）；来料验收·液压杆检测：印刷包装验收方案（250）

行业应用：印刷包装塑胶结构件测量应用指南：Rmr与Rz控制（223）；印刷包装手机中框测量应用指南：波纹度与RSm控制（224）；印刷包装薄膜开关测量应用指南：Ra与Rmr控制（225）

测量原理：粗糙度仪仪器校准：光路与传感（222）；粗糙度仪仪器校准：信号与算法（223）；粗糙度仪仪器校准：标定与溯源（224）

科研与技术文件：公司理念；售后服务与技术支持；影像测量仪选型

同系列产品：TAYLOR、TAYLOR-INTRA、TAYLOR-GXPGI、TAYLOR-LUPHOS、TAYLOR-I、TAYLOR-PGI、TAYLOR-ZCPGI、TAYLOR-SURTRONIC

服务热线：400-812-7833 / 021-58391850　邮箱：shanghai@yr17.net

地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路1478号 201411

资料生成时间：2026-11-21 15:17　本资料为可编辑模板，参数以合同与技术协议为准。